

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 26 年 4 月 17 日 (2014.4.17)

【公開番号】特開 2011-249787 (P2011-249787A)

【公開日】平成 23 年 12 月 8 日 (2011.12.8)

【年通号数】公開・登録公報 2011-049

【出願番号】特願 2011-99547 (P2011-99547)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/78 6 2 4

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 2 月 28 日 (2014.2.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

酸化物半導体を半導体層に用いたトランジスタを、遮光性を有する測定室に配置し、前記測定室内に、乾燥空気、窒素、又はアルゴンを導入し、
露点 - 110 以上 - 5 以下の雰囲気下に保持された前記測定室内で、前記トランジスタのゲート電極に所定の電圧を一定時間印加して、しきい値電圧の経時変化を測定するトランジスタの測定方法。

【請求項 2】

酸化物半導体を半導体層に用いたトランジスタを、遮光性を有する測定室に配置し、前記測定室内に、乾燥空気、窒素、又はアルゴンを導入し、
露点 - 110 以上 - 30 以下の雰囲気下に保持された前記測定室内で、前記トランジスタのゲート電極に所定の電圧を一定時間印加して、しきい値電圧の経時変化を測定するトランジスタの測定方法。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、
乾燥空気、窒素、又はアルゴンを導入する前に、前記測定室内を真空排気する、トランジスタの測定方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一項において、
前記測定室が、波長 400 nm 以下の光に対する遮光性を有する、トランジスタの測定方法。

【請求項 5】

酸化物半導体を半導体層に用いたトランジスタを、測定室に配置し、
前記測定室内に、乾燥空気、窒素、又はアルゴンを導入し、
露点 - 110 以上 - 5 以下の雰囲気下に保持された前記測定室内で、
前記トランジスタのしきい値電圧を測定する第 1 のステップと、前記トランジスタのゲート電極に所定の電圧を一定時間印加した後、前記トランジスタのしきい値電圧を測定する第 2 のステップとをこの順で行うトランジスタの測定方法。